

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成28年9月1日(2016.9.1)

【公開番号】特開2015-129928(P2015-129928A)
 【公開日】平成27年7月16日(2015.7.16)
 【年通号数】公開・登録公報2015-045
 【出願番号】特願2014-252222(P2014-252222)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 1/86 (2012.01)
 G 0 3 F 1/74 (2012.01)
 H 0 1 L 21/027 (2006.01)
 H 0 1 J 37/22 (2006.01)
 H 0 1 J 37/28 (2006.01)
 G 0 1 Q 30/04 (2010.01)
 G 0 1 Q 30/02 (2010.01)

【F I】

G 0 3 F 1/86
 G 0 3 F 1/74
 H 0 1 L 21/30 5 0 2 P
 H 0 1 J 37/22 5 0 2 H
 H 0 1 J 37/22 5 0 2 L
 H 0 1 J 37/28 X
 H 0 1 J 37/28 B
 G 0 1 Q 30/04
 G 0 1 Q 30/02

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成28年7月11日(2016.7.11)
 【誤訳訂正1】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 1 8
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 1 8】

別の態様において、少なくとも2つの画像のうち少なくとも1つの画像は、走査プローブ顕微鏡によって記録される。更に別の態様によって、走査プローブ顕微鏡は、原子間力顕微鏡及び/又は走査トンネル顕微鏡及び/又は磁気力顕微鏡及び/又は近接場走査光学顕微鏡及び/又は近接場走査音響顕微鏡及び/又は走査型静電容量顕微鏡を含む。

【誤訳訂正2】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 5 5
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 5 5】

走査プローブ顕微鏡440は、図4に示す例においては原子間力顕微鏡(AFM)である。AFMの代わりに、走査トンネル顕微鏡も使用することができる。例えば、フォトマスク200、300のようなサンプル405を検査するために、トンネル電流(走査トンネル顕微鏡)及びファンデルワールス力(力顕微鏡)以外に多くの更に別の物理量を使用することができる。磁気力顕微鏡は、例えば、サンプル405とプローブ又はその先端と

の間の磁気相互作用を利用する。サンプル405の検査のために走査音響顕微鏡はフォノンを使用し、近接場走査光学顕微鏡は光子を使用する。異なるタイプの走査プローブ顕微鏡のこの羅列は、例示に過ぎず決して完全ではない。